

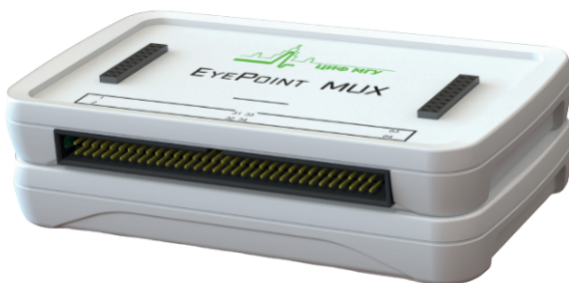
# EYEPOINT MUX

Мультиплексор **EYEPOINT MUX** - устройство, позволяющее автоматизировать входной контроль микросхем и тестирование краевых разъемов печатных плат.

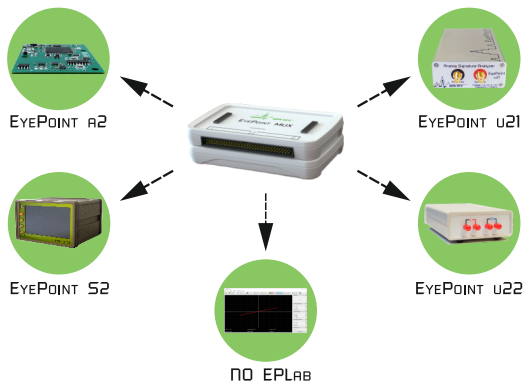
Предназначен для коммутирования одного входного канала на любой из выходных каналов в заданной оператором последовательности.

Состоит из основного блока **EYEPOINT MUX\_M** и подключаемых к нему модулей **EYEPOINT MUX\_S\_A**.

Работает совместно с измерителем и специализированной оснасткой.



## Совместимость с линейкой EYEPOINT



## Краткое описание частей мультиплексора

EyePOINT MUX\_M



**Основной блок** мультиплексора, необходимый для работы модулей EyePOINT MUX\_S\_A

Позволяет подключить до 8 модулей на 64 канала

EyePOINT MUX\_S\_A

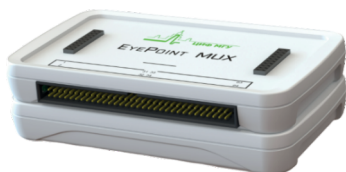


**Модуль** мультиплексора на 64 канала. Подключение «один ко многим»

Позволяет зондировать каждый из 64 каналов по отношению к общему проводу

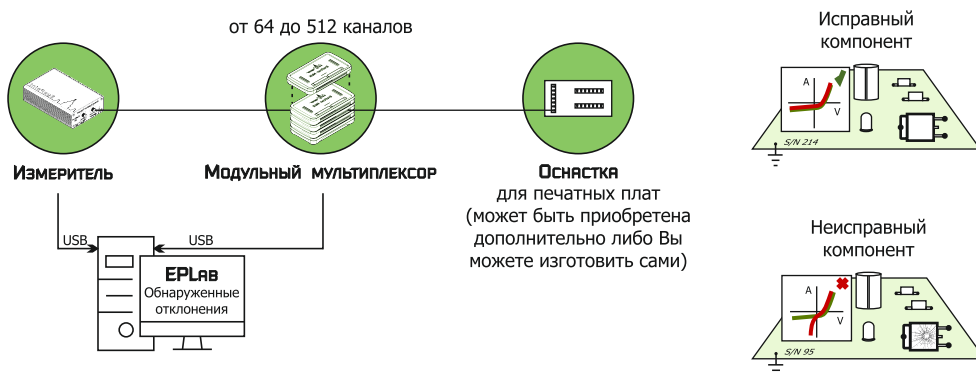
## Скалирование модулей

Возможность соединения модулей EyePOINT MUX для получения большего количества выходных каналов



Максимальное количество соединяемых модулей - **8 штук**, что дает **512 каналов** на выходе

# Тестирование печатных плат

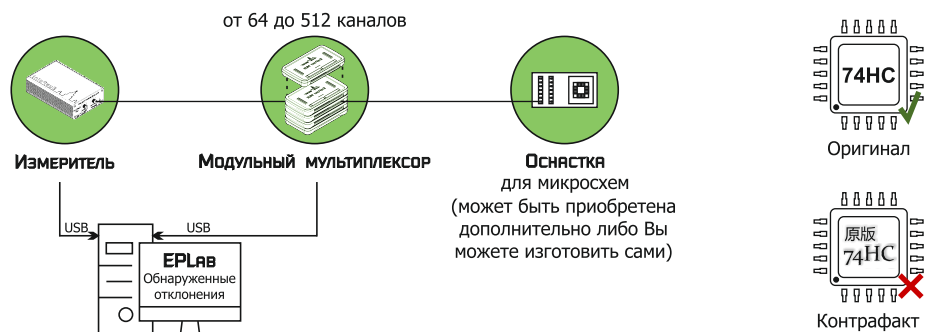


Введенные в отношении нашей страны санкции вызвали уход практически всех поставщиков электронных компонентов с рынка. Так как закупка новых компонентов стала ограничена, компаниям приходится чинить старые платы. Зачастую за счет отслуживших устройств. Поэтому в ходе ремонта важно не только выявить повреждения, которые нужно устранить, но и убедиться в исправности компонентов, планируемых для монтажа на плату.

Комплексная система на основе **EyePoint MUX** с помощью метода аналогового сигнатурного анализа позволяет автоматизировать обнаружение поврежденных электронных компонентов, а также выявление возможных неисправностей, таких как разрывы в цепи, непроай, выход из строя защитных диодов, повреждение входных/выходных цепей и т.д.

Благодаря входящему в комплект поставки ПО **EPLab** Вы получите отчет о выполненном тестировании с полным перечнем обнаруженных дефектов электронных компонентов.

# Тестирование микросхем



Глобальная проблема современности - дефицит полупроводников. Вызванное этим повышение цен на чипы спровоцировало огромный приток контрафакта. Без специального оборудования выявить подделку практически невозможно, а использовать непроверенные микросхемы опасно. Что же делать, чтобы не нести серьезные убытки?

Разработанная в ЦИФ МГУ комплексная система для тестирования микросхем на основе **EyePoint MUX** позволит проверить состояние чипов и выполнить входной контроль, выявляя контрафактные и перемаркированные чипы до того, как они будут использованы в серийном производстве, а входящее в комплект поставки ПО **EPLab** предоставит отчет о выполненном тестировании.



Страница EYEPOINT MUX  
на нашем сайте [physlab.ru](http://physlab.ru)

ООО «ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова»  
119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1  
Телефон: +7 (499) 343-56-24 e-mail: [info@physlab.ru](mailto:info@physlab.ru)  
[physlab.ru](http://physlab.ru)